

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 馬渡宏泰 副委員長 弓削哲史

幹事 安里 彰・岡村寛之 幹事補佐 マラット ザニケエフ・田村信幸

日時 12月18日(金) 13:30~15:20

会場 機械振興会館地下3階6号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 信頼性国際規格, 保全性, 信頼性一般

1. Nonparametric interval estimation of software reliability measures using wavelets
Xiao Xiao (Tokyo Metropolitan Univ.)
2. トレンド再生過程の故障率関数に対するノンパラメトリック最尤推定法 齋藤靖洋・○土肥 正(広島大)
3. Halstead ソフトウェアメトリクスを用いたソフトウェアテストの最適資源配分に関する考察
○岡村寛之・コウ ビン・土肥 正(広島大)
4. ディペンダビリティに関する国際標準化の動向(2015)
○原田文明(富士ゼロックスアドバンスドテクノロジー)・木下佳樹・武山 誠(神奈川大)

◆IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催 日本信頼性学会協賛

☆R 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

2月19日(金) あざれあ(静岡市)[12月11日(金)] テーマ:機構デバイスの信頼性, 信頼性一般(共催:継電器・コンタクトテクノロジー研究会, IEEE CPMT JAPAN, IEEE Reliability Society Japan Chapter, 協賛:日本信頼性学会)

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

岡村寛之(広島大)

E-mail: okamu@rel.hiroshima-u.ac.jp